

D4SBL40

400V 4A

特長

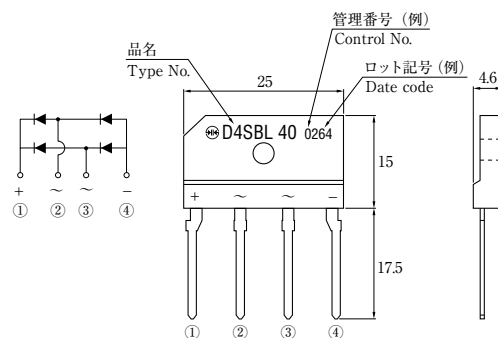
- 薄型 SIP パッケージ
- LLDブリッジ
- 高速応答 (Trr が短い)

Feature

- Thin-SIP
- Super FRD-Bridge
- Quick-response Trr

■外観図 OUTLINE

Package : 3S

Unit : mm
Weight : 3.9g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

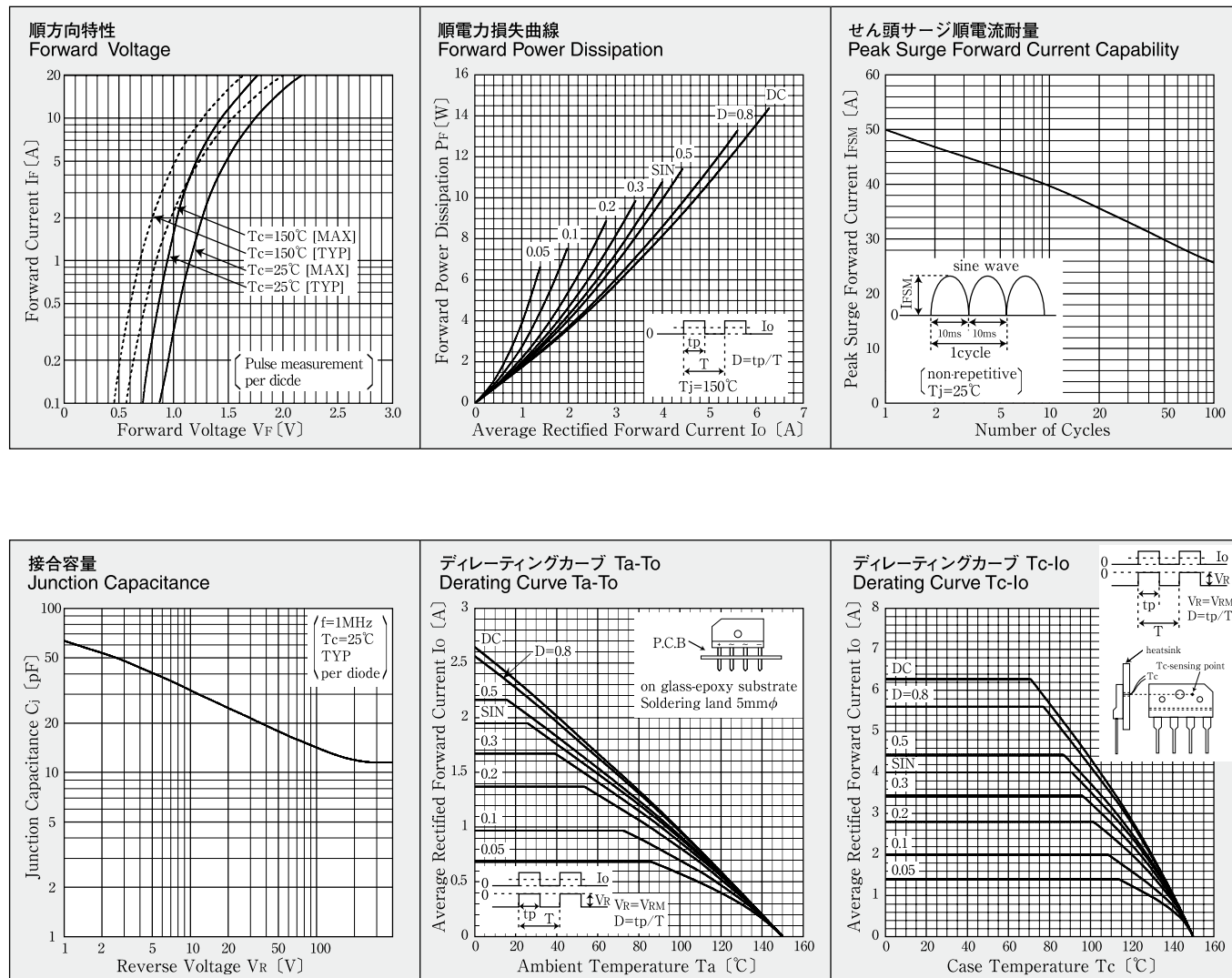
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D4SBL40	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			- 55~150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			400	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink	4	A
			フィンなし Without heatsink	1.95	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, Tj = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj = 25℃		50	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値 : 0.5 N・m) (Recommended torque : 0.5 N・m)		0.8	N・m

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 2.5A, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.3	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F = 0.5A, I _R = 1A, 1 素子当たりの規格値 per diode	MAX 50	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間, フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 5.5	℃/W
	θ _{jl}	接合部・リード間, フィンなし Junction to Lead, Without heatsink	MAX 6	
	θ _{ja}	接合部・周囲間, フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink	MAX 30	

特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
- Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
- Typical is a statistical average of the device's ability.